

УДК 537.622.4

## СТРУКТУРНО-ФАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ ДВУХСЛОЙНЫХ ПЛЕНОК Co/Cu и Co/Cr

*М. Маршалек\*, С.И. Проценко, А.Н. Чорноус*

*\*Институт ядерной физики им. Г. Неводничански, г. Краков, Польша;  
Сумський державний університет, г. Суми, Україна*

*Представлен анализ литературных и экспериментальных данных об особенностях фазового и структурного состояния конденсата Co в двухслойных пленочных системах Co/Cu/P и Co/Cr/P (P - подложка). Сделан вывод, что в первом случае в пленках, прошедших отжиг до  $T_{отж} < 600$  К, наблюдаются ГЦК-Си, ГПУ-Со и ГЦК-т.р. (Си – Со), а при  $T_{отж} > 600$  – ГЦК-Си, ГЦК-т.р. (Си – Со) и ГПУ Со в виде малых частиц, образовавшихся при частичном распаде т.р. В случае пленок Co/Cr/P наблюдается двухфазный состав ГПУ-Со и ОЦК-Cr (квазивентиляция).*

### ВВЕДЕНИЕ

Чрезвычайный интерес к пленочным гранулированным сплавам, которые получаются путём одновременного осаждения двух несмешивающихся в массивном состоянии металлических компонентов, один из которых является магнитным (например, Co, Ni, Fe), а другой – немагнитным (например, Si или Ag), связан с открытием в них эффекта гигантского магнетосопротивления (ГМС) [1-7]. Поскольку в многослойных пленках Co/Cu/P (P – подложка) реализуются [8] элементы гранулированного состояния, то в последнее время эти пленочные структуры активно используются как материал с ГМС (см., например, [10-14]) или как фрагмент [15] спин-вентильных структур типа  $(Co/Tb)_n/Co/Cu/Co$ .

Несмотря на большое количество работ, посвященных исследованию фазового состава и кристаллической структуры гранулированных сплавов  $Co_xCu_{1-x}$  [6,7] или многослойных пленочных структур Co/Cu/P [8,11], элементного состава и диффузионных процессов [15,16], ряд вопросов, связанных с фазообразованием в мультислоях Co/Cu, остается малоизученным.

В связи с этим цель настоящей работы состояла в экспериментальном изучении фазового состава двухслойных пленок Co/Cu/P и Co/Cr/P (P – NaCl, пленка С) и термодинамическом анализе особенностей фазово-структурного состояния тонкой пленки Co (3...10 нм), состоящей из еще несоприкасающихся островков на поверхности пленки Si и Cr.

### 1. МЕТОДИКА ЭКСПЕРИМЕНТА И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

В отличие от работ [6-8,11], в которых пленочные структуры получались методом ВЧ ионного [8] и магнетронного распыления [11] или электрохимического осаждения гранулированных сплавов [6,7], нами, как и в работах [12-14], при-

менялось резистивное (Si, Cr) и электронно-лучевое испарение (Co). Рабочий вакуум составлял  $10^{-4}$  Па (установка ВУП 5М). Толщина пленок Si и Cr 15...30 нм, а конденсаторов Co 3...10 и 40 нм. Выбор пленки Si в качестве нижнего слоя обоснован во введении, а выбор пленок Cr был продиктован желанием сделать более обобщающие выводы относительно фазового состояния кластеров и островков Co на металлических подложках. Пленочные образцы, полученные при  $T_{отж} \geq 300$  К, отжигались до 5 мин при  $T_{отж}=500, 600, 700$  и 900 К и после охлаждения до комнатной температуры подвергались электронно-микроскопическим и дифракционным исследованиям (микроскоп ЭММА 4). Толщина тонких образцов оценивалась путем экстраполяции градуированной зависимости пропускания света от толщины, полученной интерференционным методом. Результаты исследований состоят в следующем.

Однослойные пленки Si, Cr и Co имеют соответственно ГЦК-, ОЦК- и ГПУ- решетку. Поскольку частицы и островки пленки очень малы (порядка 1...10 нм), то в них отсутствуют дефекты упаковки (ДУ), которые могут быть центрами зарождения кристаллитов ГЦК-фазы.

При увеличении толщины пленки Co до 10 нм или при отжиге  $T_{отж}=600...700$  К в системе Co/Cu происходит укрупнение островков, появление ДУ и, как следствие этого, - появление на электронограммах относительно слабых линий (220) и (311), соответствующих ГЦК-Co. Необходимо особенно подчеркнуть, что появление этих отражений от образцов, прошедших отжиг до 600 К, нельзя связывать с полиморфным ГПУ  $\rightarrow$  ГЦК-переходом, поскольку в массивных образцах он происходит при  $T=690$  К, а в малых частицах в результате проявления фазового размерного эффекта (см. разд. 2) может произойти при  $T \geq 600$  К. В образцах Co/Cu линия (111) ГЦК-Co не фиксируется, но на месте линии (111) ГЦК-Si с  $d_{111}=0,208$  нм появляется линия с  $d_{111}=0,205$  нм, что является средним между  $d_{111}$  (Si) и  $d_{111}$  (ГЦК-Co) = 0,203 нм (таблица

ца). Дальнейшее увеличение температуры отжига до 600...700 К обуславливает увеличение  $d_{111}$  до значения 0,213 нм, что можно объяснить образованием метастабильного твердого раствора (т.р.) на основе ГЦК-решетки меди (так называемая  $\beta$ -фаза (Cu-Co) [9].

Пленки Co/Cu с эффективной толщиной конденсата Co  $d \approx 3 \dots 10$  нм, прошедшие отжиг до 900 К, скорее всего, двухфазные (ГЦК-т.р. Cu-Co и следы ГПУ-Со (рис. 1,а)).

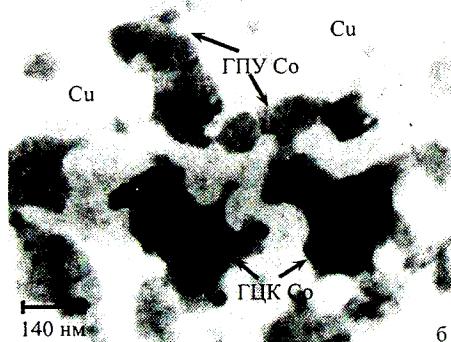
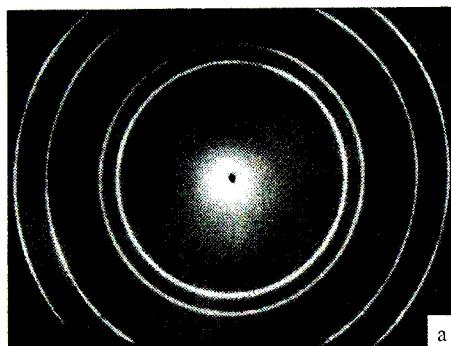


Рис.1. Электронограмма от ГЦК т.р. Co-Cu (а) и микроструктура двухслойной пленки Co(40)/Cu(30), отожженной до 900 К и охлажденной до 300 К (б). В скобках указана толщина в нанометрах

Так как параметр ГЦК-решетки  $a=0,362$  нм несколько (в пределах точности измерения  $\Delta a=\pm 0,001$  нм) больше по сравнению с параметром  $a_0=0,3608$  нм для массивной меди, то можно

#### Расшифровка электронограмм от образцов Co/Cu, прошедших термообработку

| T <sub>отж</sub> =500 К |       |         |                   | T <sub>отж</sub> =900 К |       |     |                   |
|-------------------------|-------|---------|-------------------|-------------------------|-------|-----|-------------------|
| I, отн.ед.              | d, нм | hkl     | Фаза              | I, отн.ед.              | d, нм | hkl | Фаза              |
| O. О. сл                | 0,249 | 111     | Cu <sub>2</sub> O | O. О. сл                | 0,250 | 111 | Cu <sub>2</sub> O |
| Cр                      | 0,219 | 100     | ГПУ-Со            | O. С                    | 0,210 | 111 | ГЦК-(Cu-Co)       |
| C                       | 0,205 | 111     | ГЦК-Си, ГЦК-Со    | O. сл                   | 0,190 | 101 | ГПУ-Со            |
| Cр                      | 0,190 | 101     | ГПУ-Со            | С                       | 0,181 | 200 | ГЦК-(Cu-Co)       |
| -                       | -     | 200     | ГЦК-Со            | O. сл                   | 0,153 | 220 | Cu <sub>2</sub> O |
| Cр                      | 0,126 | 220,110 | ГЦК-Си, ГПУ-Со    | Ср                      | 0,130 | 220 | ГЦК-(Cu-Co)       |
| Cр                      | 0,107 | 311     | ГЦК-Си            | сл                      | 0,128 | 220 | ГЦК-Си            |
| -                       | -     | -       | -                 | Ср                      | 0,111 | 311 | ГЦК-(Cu-Co)       |
| -                       | -     | -       | -                 | сл                      | 0,109 | 311 | ГЦК-Си            |

## 2. ТЕРМОДИНАМИЧЕСКИЙ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

В связи с полиморфизмом Со в массивных образцах представляется целесообразным проанализировать вопрос о фазовом размерном эффекте в пленках Со, сконденсированных на металлической подслой. Согласно [19] (см. более подробно в [20]) снижение температуры полиморфного ГПУ $\rightarrow$ ГЦК-перехода при уменьшении эффективной толщины (или размера островка) можно записать таким образом:

$$\frac{\Delta T'}{T_0} = \frac{T_0 - T'}{T_0} = \frac{(\sigma_1 - \sigma_2) + (\sigma_{13} - \sigma_{23})}{d^* \cdot \lambda_{12}}, \quad (1)$$

где  $T_0$ ,  $T'$  – температура полиморфного перехода в массивном Со и в пленке Со, находящейся на поверхности металлической пленки;  $\lambda_{12}$  – теплопроводность перехода;  $\sigma$  – удельная поверхностная энергия (пояснение на рис.2);  $d^*$  – критическая толщина перехода.

Соотношение (1) можно преобразовать к виду:

$$\frac{\Delta T'}{T_0} = \frac{\Delta T}{2T_0} + \frac{(\sigma_1 - \sigma_2)}{d^* \cdot \lambda_{12}}, \quad (2)$$

где  $\Delta T$  – снижение температуры перехода в свободной пленке Со.

Анализ соотношения (2) позволяет сделать такие выводы:

- при выполнении равенства  $\sigma_{31} = \sigma_{23}$  снижение температуры перехода  $\Delta T'$  будет в два раза меньше по сравнению с  $\Delta T$ ;

- при  $\sigma_{31} < \sigma_{23}$   $\Delta T'$  будет меньше  $\Delta T$  более чем в два раза, и может возникнуть ситуация, когда ГЦК-Со не будет образовываться;

- при обратном неравенстве  $\sigma_{31} > \sigma_{23}$  теоретически возможно более значительное снижение температуры перехода по сравнению с первым случаем.

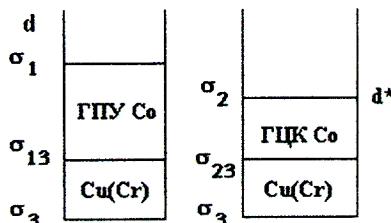


Рис.2. Изменение условий фазового равновесия ГПУ- или ГЦК-Со на поверхности металлической пленки

Исходя из полученных нами результатов, можно сделать вывод, что в случае пленочной системы Со/Ср однозначно, а в случае системы

Со/Си – возможно не происходит образование ГЦК Со. Метастабильный ГЦК-т.р. Со-Си, скорее всего, образуется на основе ГЦК-Си. Эти выводы в какой-то мере подтверждаются данными работ [21] и [22], согласно которым в двухслойных пленках Со/Cr/П и Со/Pd/П ГЦК-Со не образуется.

В работе [18] исследована структурная стабильность адсорбционных атомов и кластеров Со на поверхности (100) Си методом молекулярной динамики. Было установлено, что при нанесении атомов Со на поверхность Си образуется поверхностный сплав. Энергия системы Со/Си сильно понижается в том случае, когда атомы Со находятся внутри слоя Си, а не в виде адсорбционного атома на поверхности. Еще более сильная стабилизация данной пленочной системы происходит, когда атомы Со образуют кластеры в глубинных слоях пленки Си. Этот вывод полностью согласуется с результатами работы [6], в которой анализировались способы включения частиц Со в моно- или поликристаллическую пленку Со.

## ВЫВОДЫ

Результаты данной работы можно сформулировать таким образом:

- пленочная система Со/Си при  $T_{\text{отк}} < 600$  К состоит из ГЦК-Си, ГПУ-Со и т.р. ГЦК-(Си-Со); появление в отдельных случаях слабых отражений на электронограммах, которые соответствуют ГЦК-Со, связано не с полиморфным ГПУ $\rightarrow$ ГЦК-переходом, а с появлением дефектов упаковки в пленке Со;

- при отжиге системы Со/Си до 900 К и последующем охлаждении до 300 К т.р. частично распадается, в результате чего в объеме пленки Си формируются частицы ГПУ-Со;

- в пленочной системе Со/Ср во всем исследованном интервале толщин и температур отжига формируется квазиизвтектика, состоящая из ГПУ-Со и ОЦК-Ср;

- особенности фазово-структурного состояния изученных пленочных систем вполне объяснимы в рамках термодинамического и энергетического анализа.

Работа была частично поддержана Фондом стипендии им. Я. Мианковского и Польским Фондом поддержки науки. За это один из авторов (Проценко С.И.) выражает искреннюю благодарность.

## ЛИТЕРАТУРА

1. И. Иноуз, Х.Ито, И.Асано и др. //ФММ. 1996, т. 79, вып.7, с. 54–64.
2. Ш. Ковач, Б. Дини, С.Р. Тейгзера и др. //ФММ. 1995, т. 79, вып.1, с. 98–109.
3. Ю.В.Кудрявцев, А.Н.Погорелый //ФММ. 1996, т. 81, вып.6, с. 96–108.

4. А.Г. Равлик, Б.А. Авраменко, Л.И. Лукашенко //Тонкие пленки в электронике. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2001, с. 55–56.
5. Б.А. Авраменко, С.Б. Малыхин, А.Г. Равлик и др. //Тонкие пленки в электронике. Харьков: ННЦ ХФТИ, 2002, с. 57–60.
6. О.И. Касютич, В.М. Федосюк, Т.А. Точицкий //Поверхность. 2002, № 3, с. 34–41.
7. В.М. Федосюк, Х.И. Блайт, О.И. Касютич //Поверхность. 2000, № 3, с. 62–65.
8. В.О. Васьковский, А.А. Ющенко, В.Н. Лепановский и др. //ФММ. 2002, т. 93, № 3, с. 43–49.
9. В.О. Васьковский, Н.Н. Щеголева, В.Н. Лепановский и др. //Изв. Вузов. Физика. 2002, № 12, с. 35–42.
10. W. Oepts, M.A.M. Gijs, A. Reinders et all. //Phys Rev. B. 1996, v. 53, № 21, p. 240–243.
11. Л.А. Чеботкевич, Ю.Д. Воробьев, И.Н. Буркова и др. //ФММ. 2000, т. 89, № 3, с. 56–61.
12. M. Marszalek, J. Jaworski, A. Michalik et all. //J. Magnetism and Mag. Mat. 2001, v. 226–230, p. 1735–1737.
13. M. Marszalek, J. Jaworski, Z. Stachura et all. //Phys. Stat. Sol (a). 2002, v. 189, № 3, p. 653–658.
14. M. Marszalek, J. Jaworski, J. Lekki et all. //Surf. Scien. 2002, v. 507–510, p. 346–350.
15. А.В. Свалов, П.А. Савин, Г.В. Курляндская и др. //ЖТФ. 2002, т. 72, вып. 8, с. 54–57.
16. M. Suzuki, Y. Taga, A. Goto et all //Phys. Rev. B. 1994, v. 50, № 24, p. 431–434.
17. J. Thomas, H.-D. Bauer, S. Baunack et all. //Cryst. Res. Technol. 2000, v. 35, № 6–7, p. 839–849.
18. Н.А. Леванов, Д.И. Бажанов, В.С. Степанюк и др. //Поверхность. 2000, № 9, с. 69–72.
19. И.Е. Проценко, М.Д. Смолин, В.Г. Шамоня и др. //Металлы. 1985, № 2, с. 171–174.
20. I.Ю. Проценко, В.А. Саенко. Тонкі металеві плівки (технологія і властивості). Суми: „СумДУ”, 2002, 187 с.
21. N. Goshima, T. Mimura, M. Nawate et all. //J. Magn. Soc. Japan. 1991, v. 15, № 2, p. 445–450.
22. S.T. Purcell, H.W. van Kesteren, E.S.Gosman //Magn. and Magnetic Material. 1991, v. 5, p. 25–30.

**THE STRUCTURAL AND PHASAL STATE  
DOUBLE-LAYERS FILM Co/Cu AND Co/Cr**  
**M. Marszalek\*, S.I. Procenko, A.M. Chornous**  
**\* H. Niewodniczanski Institute of Nuclear Physics,  
Crakow, Poland**

**Sumy State University, Sumy, Ukraine**

The results of analyses of literatural and experimetal dates of phasal and structural state film Co in double-layers films Co/Cu/S and Co/Cr/S (S-substrate) is represented. In the first case in film, the past annealing to  $T_{ann} < 600$  K, is observing FCC Cu, HCP and FCC Co and FCC s.s. (Cu-Co), and up to  $T_{ann} > 600$  K – FCC Cu, FCC s.s. (Cu-Co) and particle HCP Co in the volume of the film Cu.